

オープン AFM NS100



操作简单

自動測定

概要

原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope) は、大気中にて、非破壊でナノメートル以下迄の3次元測定が可能な唯一の顕微鏡です。サンプルを傷つけることなく、測定可能で、電磁スキャナーを使用することにより、非線形クランプ、や経年変化を気にせず、長期に渡り安定測定が可能になりました。ステージ付きで、ワークを切断することなく、サンプルをセットするだけで非破壊で測定可能です。測定モードも多種用意されており、高価なAFM装置と同等の機能を有します。測定ワークの材質に関係無く、導体から絶縁体迄、コーティング無しで、ナノレベルの測定が直ぐに可能です。ステージサイズはサンプルに合わせ、小型から大型まで、ご要望に添います。

装置仕様

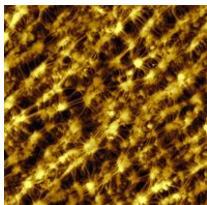
☆ 走査ヘッド:	高分解能型	広域走査型
☆ 最大走査レンジ	10 μ m	110 μ m
☆ 最大Zレンジ	2.0 μ m	22 μ m
☆ Z方向分解能	0.000107 nm *1	0.0013 nm *1
☆ XY方向分解能	0.00059 nm *1	0.0065 nm *1
☆ 非線形性	<0.6%	<0.6%
☆ Zノイズレベル (RMS)	40 p m	90 p m

アプリケーション

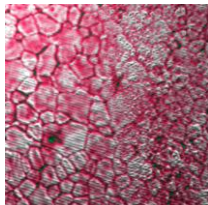
微細線幅測定	高精度金型の表面解析
マスクパターンの測定	光学部品の評価
研磨、ラッピングの評価	ハードディスクの磁気フィールドの観察
薄膜の段差測定	DVDピットやスタンパー検査
成膜時の連続、不連続判定	量子ドットの測定
	フィルムの表面検査
	注) *1は24ビットで割った値

測定検査例

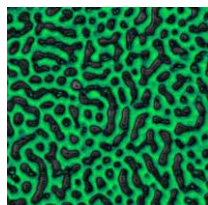
PTFE膜



蒸着薄膜面



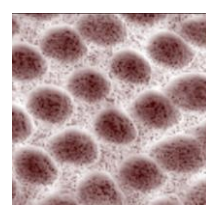
共重合体



原子ステップ



ナノグリッド



ICパターン

